

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore[®]**
RELEASE 1.4Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer](#) [Quick Links](#) [Review](#)[» Search](#)**Welcome to IEEE Xplore[®]**

- ☐ [Home](#)
- ☐ [What Can I Access?](#)
- ☐ [Log-out](#)

Tables of Contents


- ☐ [Journals & Magazines](#)
- ☐ [Conference Proceedings](#)
- ☐ [Standards](#)

Search

- ☐ [By Author](#)
- ☐ [Basic](#)
- ☐ [Advanced](#)

Member Services

- ☐ [Join IEEE](#)
- ☐ [Establish IEEE Web Account](#)
- ☐ [Access the IEEE Member Digital Library](#)

 [Print Format](#)Your search matched **1** of **945031** documents.

A maximum of **1** results are displayed, **15** to a page, sorted by **Relevance** in **descending** order.
You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text
Then click **Search Again**.

Results:Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 Modelling base transport properties of npn SiGe HBT***Sokolic, S.; Amon, S.;*

Semiconductor Conference, 1996., International , Volume: 1 , 9-12 Oct. 1996

Page(s): 263 -266 vol.1

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(340 KB\)\]](#) **IEEE CNF**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved